

えつくすせんしょうかくさんらんほう

# X線小角散乱法

## ■ 用語解説 ■

X線を照射し、散乱した X線を測定することで物質の構造情報を得る手法である。広角散乱分析法（X線回折）は結晶中の原子配列のオンGSTROOM ( $1 \times 10^{-10}$ メートル)オーダーの分析に使用されるのに対し、小角散乱法は微粒子や液晶、合金の内部構造の数ナノメートル ( $1 \times 10^{-9}$ )レベルの構造の分析に使用する。→小角散乱法